

## Настольные сканирующие электронные микроскопы LANSEM



LANSEM 15X / LANSEM 15 / LANSEM 30



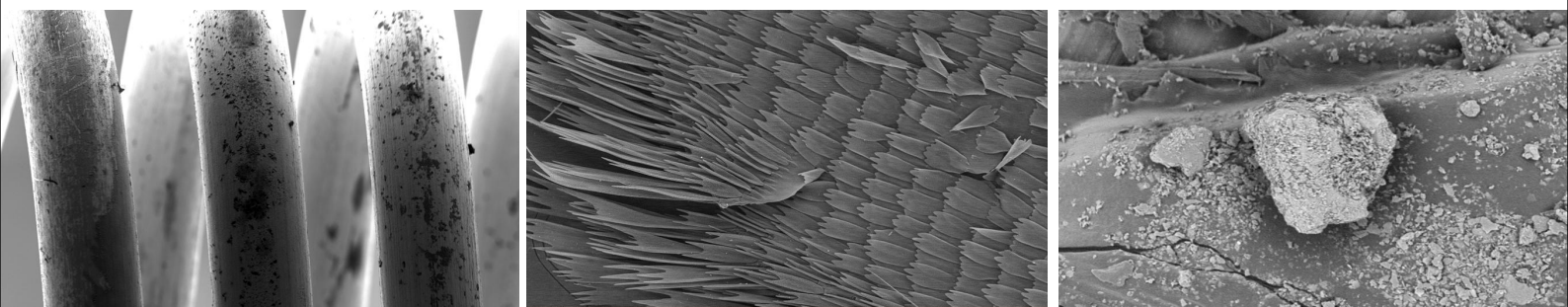
LANSEM 20

### Описание

Настольные сканирующие электронные микроскопы серии LANSEM используют передовые электронно-оптические технологии, оснащены системой с высоким ускоряющим напряжением, возможностью исследования материалов во вторичных электронах и обратно-рассеянных, и специализированным программным обеспечением для анализа данных, которое позволяет выполнять автоматическую фокусировку, быстрое сканирование и наблюдение за распределением элементов образца в реальном времени (в видеорежиме), обеспечивая точную и эффективную регистрацию и анализ изображений. Прибор подходит для анализа таких материалов, как металлы, керамика, аккумуляторы, микроэлектроника, покрытия, биологические образцы, цемент, и является мощным инструментом для научных исследований и промышленного контроля.

### Технические характеристики

| Характеристика                  | LANSEM 15X             | LANSEM 15   | LANSEM 20 | LANSEM 30 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Тип катода                      | W – вольфрамовый катод |             |           |           |
| Ускоряющее напряжение, кВ       | 15                     |             | 20        | 30        |
| Максимальное увеличение, х      | До 250 000 х           |             |           |           |
| Детекторы                       | BSE                    | SE, BSE     |           |           |
| ЭДС детектор                    | -                      | опционально |           |           |
| Максимальный размер образца, мм | Ø 90                   |             | Ø 200     | Ø 90      |
| Максимальная высота образца, мм | 40                     |             | 60        | 40        |



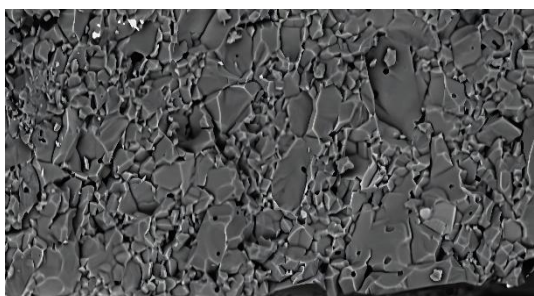
## Настольный сканирующий электронный микроскоп LANSEM 15 / LANSEM 15X

Компактный СЭМ/SEM/РЭМ, интегрированный элементный анализ (ЭДС/EDS), режим низкого вакуума, диапазон ускоряющего напряжения до 15 кВ.

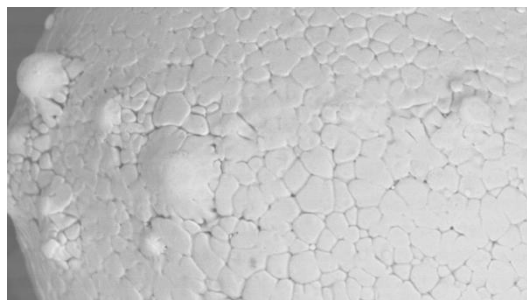


### Ключевые преимущества

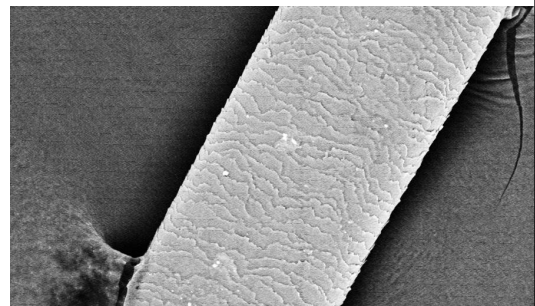
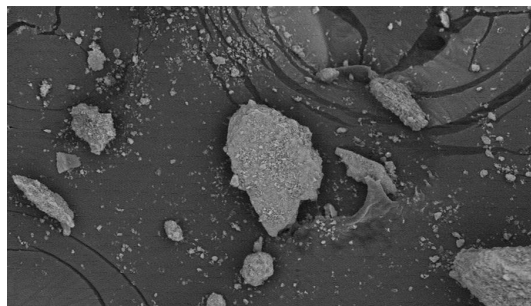
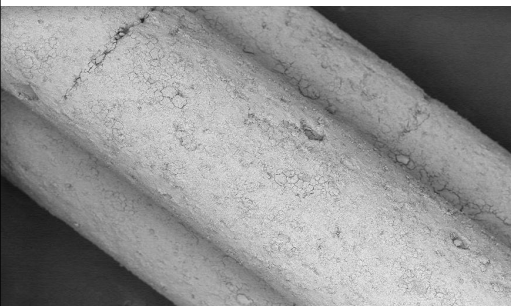
- **Классический вольфрамовый катод:** проста в эксплуатации, легкая замена и обслуживание.
- **Ускоряющее напряжение до 15 кВ** обеспечивает эффективную работу с широким спектром материалов: от чувствительных полимеров и биологических объектов до металлических сплавов и электронных компонентов.
- **SE и BSE детекторы:** детектор вторичных электронов (SE) для детального изучения микрорельефа и фрактографии, четырёхсегментный детектор обратно-рассеянных электронов (BSE) для выявления фазового состава (контраст по среднему атомному номеру).
- **Встроенный энергодисперсионный спектрометр (EDS)** с активной площадью 30 мм<sup>2</sup> — позволяет проводить локальный элементный анализ от бора (В) до калифорния (Сf) с разрешением 130 эВ.
- **Увеличенная вакуумная камера и моторизованный столик:** максимальный размер образца до Ø 90×40 мм; моторизованный столик X-Y-Z: перемещение X: 25 мм, Y: 25 мм, Z: 30 мм.



Керамические материалы



Аддитивные порошки



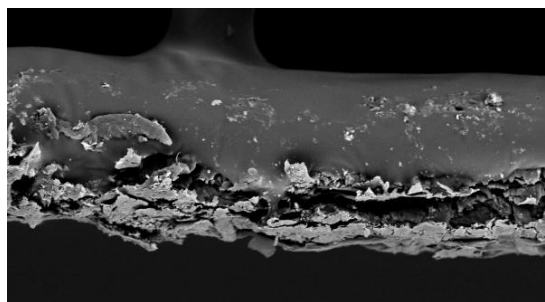
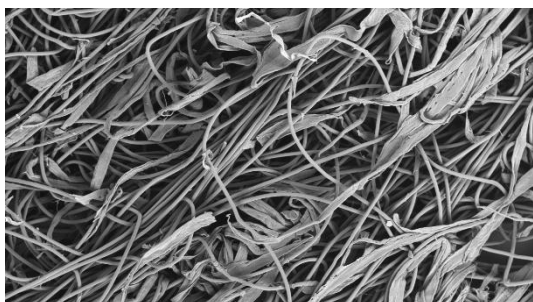
## Настольный сканирующий электронный микроскоп LANSEM 20

Компактный СЭМ/SEM/РЭМ, интегрированный элементный анализ (ЭДС/EDS/EDX), режим низкого вакуума. Увеличенная камера, возможность работы с габаритными образцами, расширенный диапазон ускоряющего напряжения до 20 кВ



### Ключевые преимущества

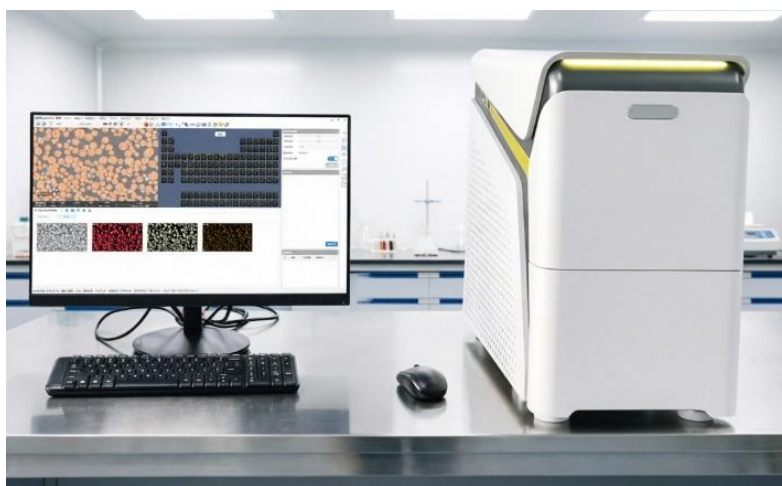
- **Классический вольфрамовый катод:** проста в эксплуатации, легкая замена и обслуживание.
- **Ускоряющее напряжение до 20 кВ** обеспечивает эффективную работу с широким спектром материалов: от чувствительных полимеров и биологических объектов до металлических сплавов и электронных компонентов.
- **SE и BSE детекторы:** детектор вторичных электронов (SE) для детального изучения микрорельефа и фрактографии, четырёхсегментный детектор обратно-рассеянных электронов (BSE) для выявления фазового состава (контраст по среднему атомному номеру).
- **Встроенный энергодисперсионный спектрометр (EDS)** с активной площадью 30 мм<sup>2</sup> — позволяет проводить локальный элементный анализ от бора (B) до калифорния (Cf) с разрешением 130 эВ.
- **Увеличенная вакуумная камера и моторизованный столик:** максимальный размер образца до Ø 200×60 мм; моторизованный столик X-Y-Z: перемещение X: 50 мм, Y: 50 мм, Z: 60 мм.



## Настольный сканирующий электронный микроскоп LANSEM 30

Компактный СЭМ/SEM/РЭМ, интегрированный элементный анализ (ЭДС/EDS), режим низкого вакуума. Расширенный диапазон ускоряющего напряжения до 30 кВ.

Доступен в Демо-зале для демонстрации на ваших образцах.  
Запись на демонстрацию по телефону: +7(495) 741-59-04 или на сайте [www.synercon.ru](http://www.synercon.ru)



### Ключевые преимущества

- **Классический вольфрамовый катод:** проста в эксплуатации, легкая замена и обслуживание.
- **Ускоряющее напряжение до 30 кВ** позволяет работать как с тонкими плёнками, так и с массивным и проводящими образцами, обеспечивая достаточную проникающую способность для анализа включений и покрытий.
- **SE и BSE детекторы:** детектор вторичных электронов (SE) для детального изучения микрорельефа и фрактографии, четырёхсегментный детектор обратно-рассеянных электронов (BSE) для выявления фазового состава (контраст по среднему атомному номеру).
- **Встроенный энергодисперсионный спектрометр (EDS)** с активной площадью 30 мм<sup>2</sup> — позволяет проводить локальный элементный анализ от бора (B) до калифорния (Cf) с разрешением 130 эВ.
- **Стандартная вакуумная камера и моторизованный столик:** максимальный размер образца до Ø 90×40 мм; моторизованный столик X-Y-Z: перемещение X: 25 мм, Y: 25 мм, Z: 30 мм.

